

第五章 半导体的导电性

第一节 载流子的散射

一、散射的概念

1、漂移运动

$$J = nqv$$

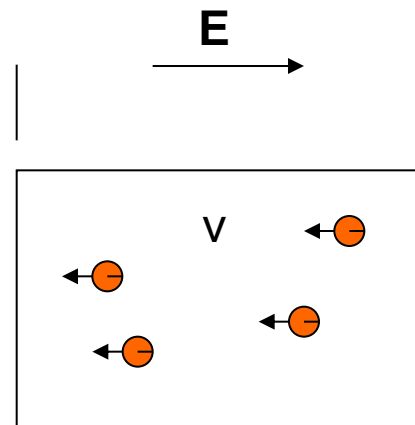
$$E \rightarrow F \rightarrow a \rightarrow v \uparrow \rightarrow J \uparrow$$

2、欧姆定律

$$J = \sigma E$$

E一定，J一定

?



载流子受到了某种阻力，在运动过程中不断遭到“散射”，从电场作用获得的漂移速度便不断地散射到各个方向上去，使漂移速度不能积累起来。在外力和散射的双重影响下，有一平均漂移速度

按固体物理理论：
周期性势场下，考虑了有效质量，
电子的运动等效为自由电子运动。

当严格的周期势场遭到破坏，
载流子的运动就不是自由的，
载流子的运动会受到散射作用。

任何破坏周期势场的因素都
可以引起载流子的散射作用。

实际晶体，各种原因导致势场偏离严格周期势场。

热运动：原子不断在平衡位置附近振动，位移破坏了场的周期。

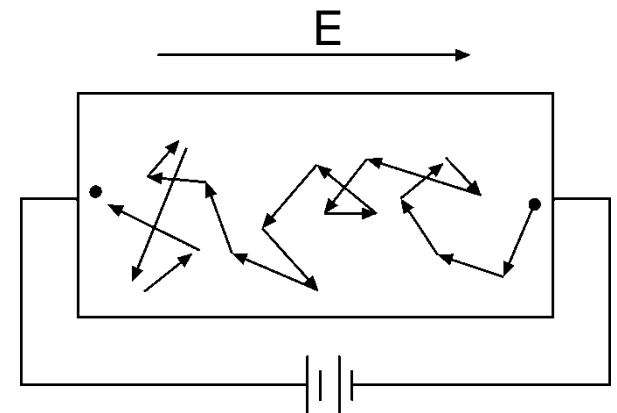
缺陷：杂质原子、原子本身几何排列上的缺陷引起势场偏离严格的周期性。

$$\Delta V(x) = V(x) - V_0(x)$$

附加势场

实际的势场

周期性势场



二、半导体的主要散射机制

- 电离杂质散射：电离杂质引起的散射
- 晶格散射与声子散射：由于晶格振动引起的散射
- 中性杂质散射：在杂质浓度不是很高时
- 电子或空穴散射：高载流子浓度
- 晶格缺陷散射：多晶体时很重要
- 表面散射：载流子在表面运动时受表面因素作用

粗糙度

1. 电离杂质散射

杂质电离后带电（施+、
形成一个库仑场（ ΔV ）

局部破坏杂质附件周期

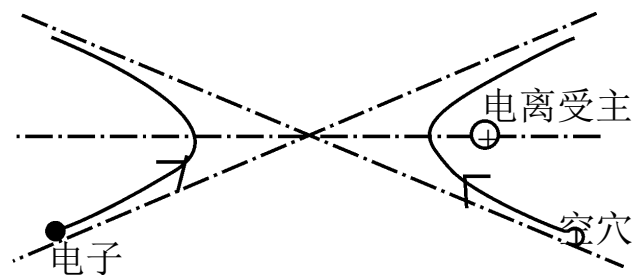
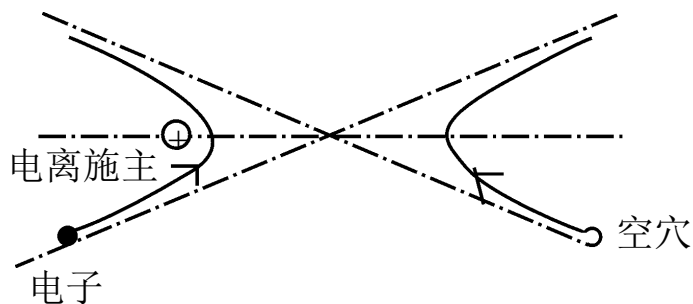
$$P_i \propto N_i T^{-3/2}$$

说明

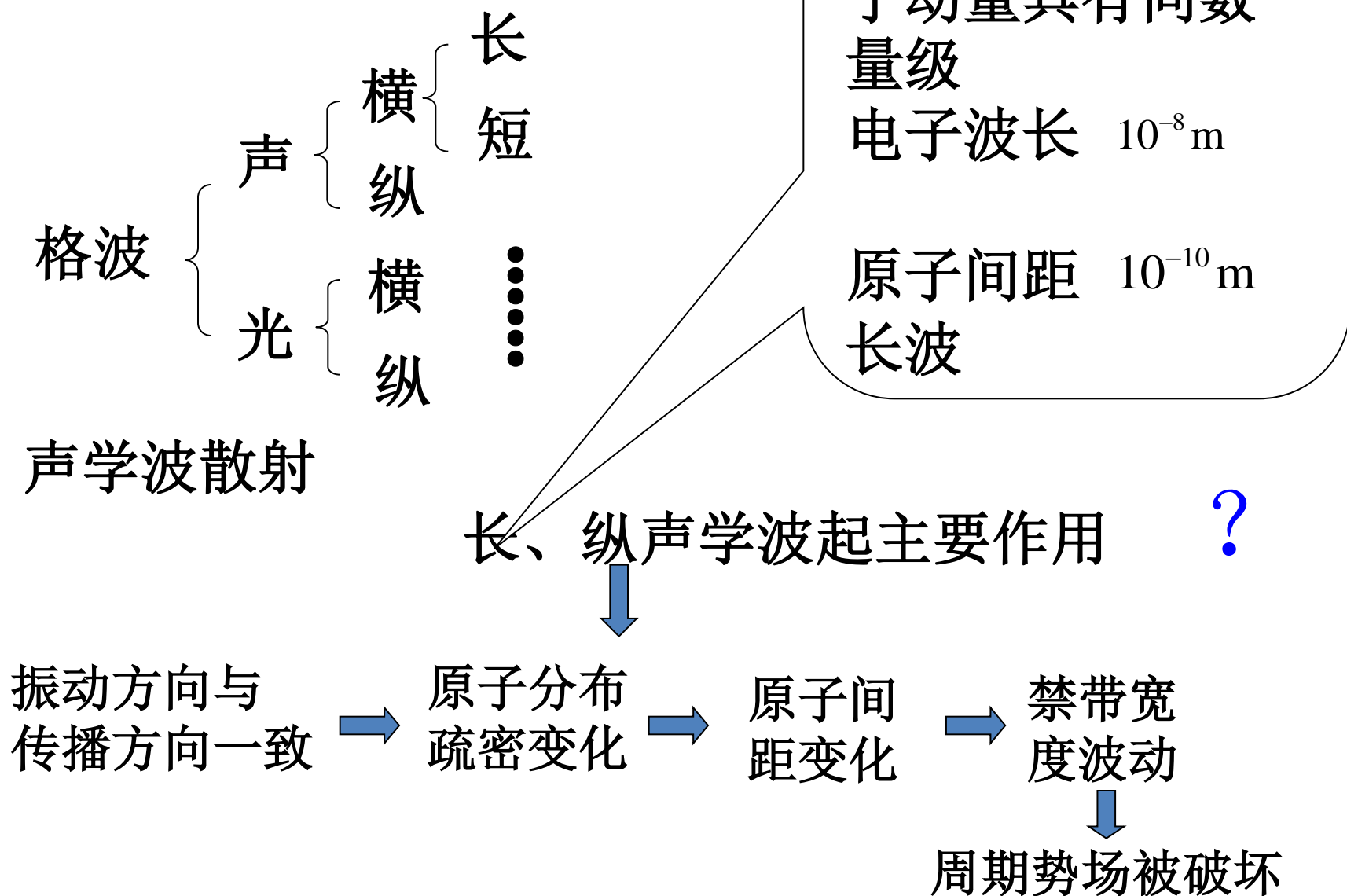
1、**Ni大，Pi大**

2、**T高，速度大，不
易被散射，偏转小**

3、**低温情况下，电离
杂质散射比较重要**




2、晶格振动的散射



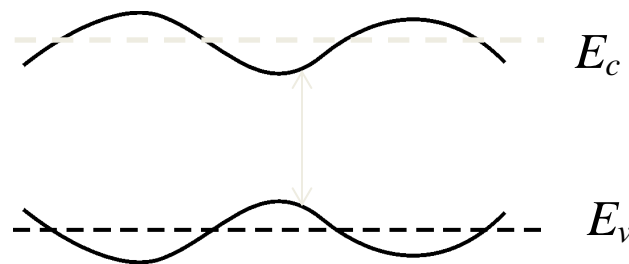
特点： a. ΔV -能带起伏引起

b. $P_s \propto T^{3/2}$



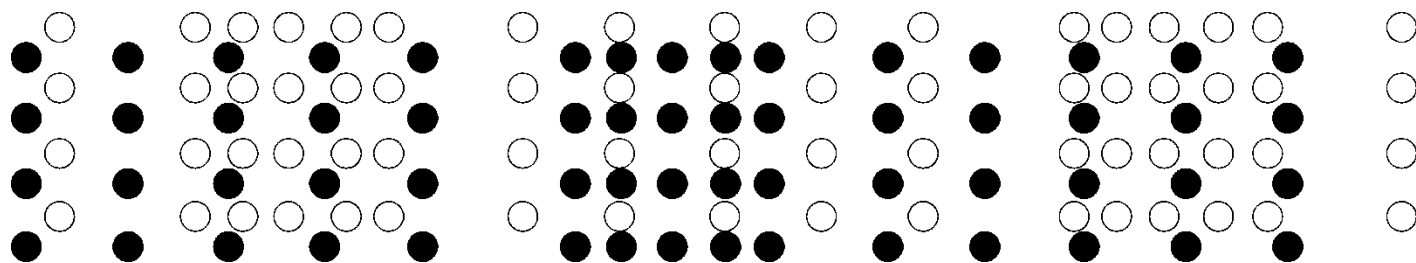
温度越高，晶格振动越强，散射几率越大

横波呢？



光学波散射

离子性半导体，温度较高时，长纵波散射作用重要



长纵
光学波



两离子振动
位移相反



电荷分
布不均



产生
电场



周期势场遭到破坏

特点：a. ΔV -内电场引起

b.
$$P_o \propto \frac{(\hbar\nu_e)^{3/2}}{(K_B T)^{1/2}} \left[\frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\nu_e}{K_B T}\right) - 1} \right] \frac{1}{f\left(\frac{\hbar\nu_e}{K_B T}\right)}$$



温度下降，散射几率按指数规律迅速减小。
光学波散射在低温时不起什么作用。

两种散射同时存在

$$P_L = P_S + P_o$$

不同半导体，两种散射强弱不同，
共价结合的元素半导体（硅和锗），长声学波散射为主，
离子性半导体中，长光学波散射为主

三、平均自由时间和散射几率的关系

1、概念

自由时间：电场作用下，载流子连续两次散射间的时间
平均自由时间 τ ：取多次自由时间的平均值

如：N个速度为v的载流子 P—散射几率

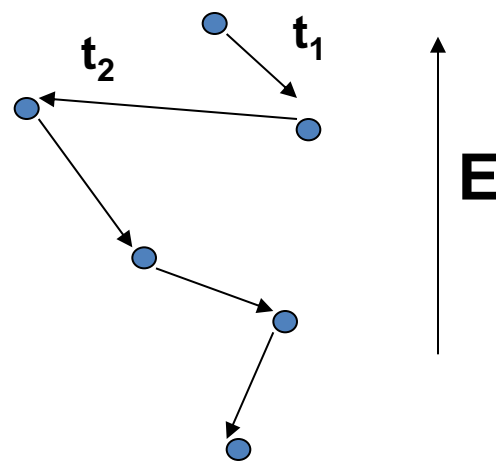
t-t+ Δt 被散射载流子数

$$N(t)P\Delta t$$

$N(t+\Delta t)$ ：t+ Δt 未散射载流子数

$N(t)$ ：t时未散射的载流子数

$$N(t) - N(t + \Delta t) = N(t)P\Delta t$$



$$\frac{dN(t)}{dt} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = -N(t)P$$

解为

$$N(t) = N_0 e^{-pt}$$

t=0时未散射的载流子数

$$N(t + \Delta t) = N_0 P e^{-pt} dt$$

Δt后被散射的载流子数

t—t+Δt内遭到散射的所有载流子的自由时间均为**τ**

平均自由时间

$$\tau = \frac{1}{N_0} \int_0^{\infty} t N_0 P e^{-pt} dt$$

两次散射间所有载流子自由时间的总和

$$= \frac{1}{P}$$

自由时间的总和

平均自由时间等于散射几率的倒数

第二节 载流子漂移运动基本规律

一、迁移率

假设：电场 \mathbf{E}

电子各向同性，有效质量 m_n^*

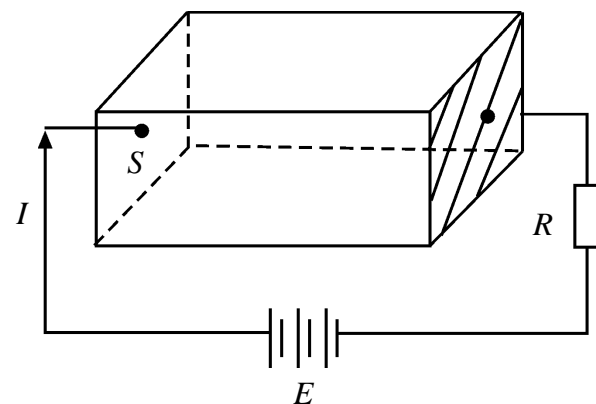
第一次散射 $t=0$ ，沿 x 方向速度 V_{0x}

加速运动 t 后速度 V_x 时受第二次散射，

$$V_x = V_{0x} - \frac{q}{m_n^*} |\vec{E}| t$$

x 方向分量的平均值应为零

平均值即可得到平均漂移速度。



电子漂移速度的总和

每个电子获得的漂移速度

平均漂移速度

$$\frac{1}{N_0} \int_0^\infty -\left(q/m_n^*\right)|E|t N_0 P e^{-pt} dt$$

遭到散射的电子数

$$\bar{V}_x = -\frac{q}{m_n^*} \frac{1}{P} |E| = -\frac{q|E|}{m_n^*} \tau_n$$

$$\mu = \frac{|\bar{V}_x|}{|E|}$$

迁移率

$$\mu_n = \frac{q\tau_n}{m_n^*}$$

$$\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*}$$

迁移率是描述载流子在电场中作漂移运动难易程度的物理量

$$\mu_n \square \mu_p$$

二、电导率

$$I = -nq\bar{V}_n \times 1 \times S$$

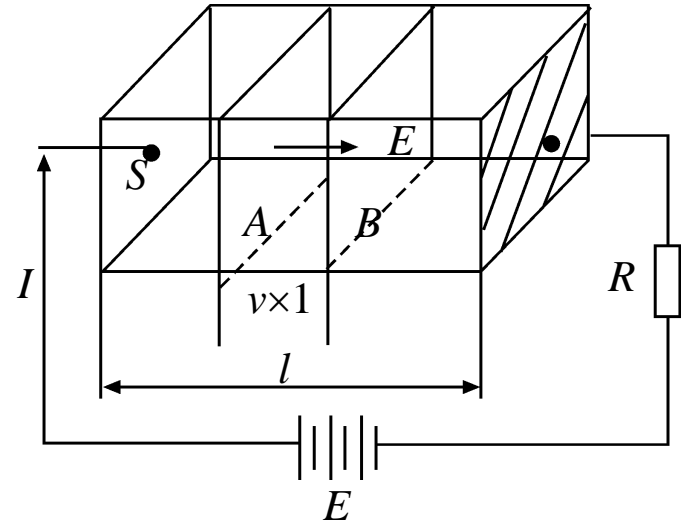
$$J_n = -nq\bar{V}_n$$

$$J_n = nq\mu_n |E|$$

$$J_n = \sigma_n |E|$$

$$\sigma_p = pq\mu_p = \frac{pq\tau_p}{m_p^*}$$

$$\sigma_n = nq\mu_n = \frac{nq\tau_n}{m_n^*}$$

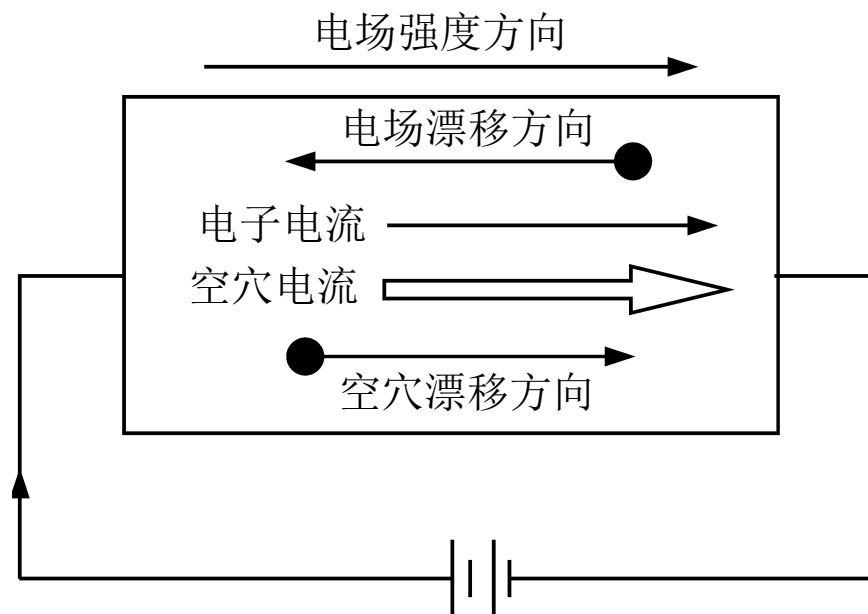


电子与空穴同时参与导电：

$$J = J_n + J_p$$

总是：

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$



n型半导体: $\sigma_n = nq\mu_n$

p型半导体: $\sigma_p = pq\mu_p$

电子、空穴同时导电: $\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$

本征半导体: $\sigma_i = n_i q (\mu_n + \mu_p)$

n型半导体: $\rho_n = \frac{1}{nq\mu_n}$

p型半导体: $\rho_p = \frac{1}{pq\mu_p}$

本征半导体: $\rho = \frac{1}{n_i q (\mu_n + \mu_p)}$

电子、空穴同时导电: $\rho = \frac{1}{nq\mu_n + pq\mu_p}$